

基于SVD的MEMS微结构位移测量新算法

胡章芳, 计超, 罗元

重庆邮电大学光电工程学院, 重庆 400065

A New Algorithm for MEMS Microstructure Amplitude Measurements Based on:

HU Zhangfang, JI Chao, LUO Yuan

Photoelectric engineering college, The Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(6\)](#)